

Diagnosing DoS attacks in NoC-based MPSoCs

Chaves Arroyave, Cesar Giovanni; Azad, Siavoosh Payandeh; Hollstein, Thomas; Sepulveda, Johanna Testmethoden und Zuverlässigkeit von Schaltungen und Systemen, TUZ 2019 2019 / p. [39–41] <https://www.researchgate.net/publication/333756736>